

## УСИЛЕНИЕ ДВУМЕРНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ВОЛН В СВЕРХРЕШЕТКАХ

А.В. Чаплик

Если плазма находится в пространственно-периодическом потенциальном поле, то в затухании плазменных волн по механизму Ландау существенную роль играют процессы переброса. В случае дрейфа двумерной электронной плазмы относительно плоской сверхрешетки возможно усиление плазменных волн в некотором интервале дрейфовых скоростей. Существенно, что усиление возникает при скоростях дрейфа много меньших фазовой скорости плазмона  $\omega/k$ .

Экспериментальные исследования ленгмюровских колебаний в двумерных электронных системах привлекают в последнее время большое внимание. Характерные параметры таких систем могут варьироваться в весьма широких пределах, что позволяет легко управлять волновыми процессами в них. С точки зрения приложений принципиальный интерес представляет вопрос о возможности усиления двумерных плазменных колебаний. Как хорошо известно, усиление возникает за счет развития какой-либо из плазменных неустойчивостей в случае дрейфа одной части плазменной среды относительно другой. В бесстолкновительном пределе пороговая скорость дрейфа, при которой начинается усиление, определяется только черенковским критерием, т.е. имеет порядок фазовой скорости плазмона  $\omega/k$  ( $\omega$  — частота,  $k$  — волновое число). В экспериментах с двумерными плазмонами величина  $\omega/k$  равна обычно  $(2 \div 5) \cdot 10^8$  см/сек.

В настоящем сообщении будет показано, что в искусственных периодических структурах — ориентационных сверхрешетках — усиление возникает при дрейфе двумерной плазмы как целого относительно сверхрешетки (т.е. без разделения плазменной среды на "покоящуюся" и "движущуюся"). Кроме того оказывается, что процессы переброса, характерные для волн в периодических структурах, снижают пороговую скорость дрейфа. В результате усиление может быть получено при дрейфовых скоростях, вполне достижимых для современной экспериментальной техники.

Одномерная ориентационная сверхрешетка возникает на поверхности монокристалла, один из индексов Миллера которой много больше двух других [1]. Если на такой поверхности создана структура металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) и возник инверсионный слой, то двумерная

плазма носителей заряда находится в одномерном периодическом потенциале с периодом много бóльшим постоянной решетки кристалла. Типичные значения периодов, созданных в настоящее время сверхрешеток, составляют  $10^2 \div 10^3 \text{ \AA}$ .

Дисперсия и столкновительное затухание двумерных плазмонов в сверхрешетках исследованы в работе Крашенинникова и автора [2]: Здесь рассмотрим затухание Ландау и обусловленное тем же механизмом усиление колебаний за счет дрейфа двумерной плазмы вдоль сверхрешетки.

Вычислим работу электрического поля монохроматической волны  $E = E_0 \exp i(kx - \omega t)$ , совершаемую над электроном, движущимся в периодическом потенциале  $U_0 \cos x/L$ . Амплитуду потенциала  $U_0$  будем считать много меньшей характерной кинетической энергии электрона. В реализуемых экспериментально МДП структурах со сверхрешетками фермиевская энергия электронов обычно на порядок превышает величину  $U_0$ . В первом приближении по  $U_0$  закон движения электрона вдоль оси  $x$  при начальном условии  $x(0) = 0$  дается формулой

$$x(t) = vt + \frac{U_0 L}{mv^2} \sin(vt/L), \quad (1)$$

где  $v$  — средняя по времени скорость надбарьерного движения частицы (запирания в потенциальных ямах быть не может вследствие условия  $U_0 \ll mv^2$ ). Под действием поля волны движение возмущается. Это возмущение  $\delta x(t)$  в линейной по  $E_0$  теории и в приближении  $U_0 \ll mv^2$  (определяется уравнением (сравн. [3])

$$\frac{d^2 \delta x}{dt^2} = \frac{eE_0}{m} \exp \left\{ i \left[ (kx - \omega - i\gamma)t - (U_0 kL/mv^2) \sin \frac{vt}{L} \right] \right\}, \quad (2)$$

$\gamma \rightarrow 0.$

Отсюда получаем

$$\delta x = -\frac{eE_0}{m} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{J_n(a) \exp \{ i [(k + g_n)vt - (\omega + i\gamma)t] \}}{[(k + g_n)v - \omega - i\gamma]^2}, \quad (3)$$

$$a \equiv U_0 kL/mv^2.$$

Здесь  $g_n = n/L$  — вектора одномерной обратной решетки,  $J_n$  — функции Бесселя. Член с  $n = 0$  в (3) соответствует пространственно однородному случаю, остальные описывают вклад процессов переброса.

Средняя по времени энергия, поглощаемая частицей, равна

$$q(v) = \frac{e}{2} \left\langle \operatorname{Re} \frac{d}{dt} (x + \delta x) E^*(x, t) \right\rangle = -\frac{(eE_0)^2}{2m} \operatorname{Im} \sum_n J_n^2(a) \frac{\omega + i\gamma}{D_n^2}, \quad (4)$$

где  $D_n = (k + g_n)v - \omega - i\gamma$ . При получении формулы (4) необходимо учитывать два вклада в скорость частицы (пропорциональные  $U_0$  и  $E_0$ ) и воспользоваться свойством бesselевых функций  $2nJ_n(z) = z[J_{n+1}(z) + J_{n-1}(z)]$ . Переходя к пределу  $\gamma \rightarrow 0$ , получим для полной поглощен-

ной энергии  $Q$  :

$$Q = \int q(v) f(v-u) dv; \quad q(v) = \frac{\pi(eE_0)^2}{2m} \sum_n J_n^2(\alpha) \frac{d}{dv} [v \delta(\omega - kv - g_n v)]. \quad (5)$$

Здесь  $u$  — скорость дрейфа плазмы относительно решетки,  $f(v)$  — функция распределения частиц по проекции скорости на направление дрейфа. Для двумерной вырожденной плазмы имеем:

$$f(v) = (m/\pi\hbar)^2 \sqrt{v_0^2 - v^2}, \quad v < v_0; \\ f(v) = 0, \quad v > v_0, \quad (6)$$

где  $v_0$  — скорость Ферми, равная  $\hbar \sqrt{2\pi N_s}/m$ ,  $N_s$  — поверхностная плотность зарядов. Обычно эксперименты с двумерными плазмонами проводятся на кремниевых МДП структурах при гелиевых температурах в интервале значений  $N_s \sim 10^{11} \div 10^{13} \text{ см}^{-2}$ . В этих условиях электроны инверсионного слоя образуют сильно вырожденный ферми-газ.

Как известно, в пространственно однородной фермиевской плазме затухание Ландау равно нулю, вследствие неравенства  $\omega > kv_0$ . В соответствии с этим исчезает вклад члена с  $n = 0$  в сумме (5). Однако процессы переброса приводят к конечному затуханию Ландау в вырожденной плазме, находящейся в периодическом потенциале. В экспериментах обычно  $k \sim 10^4 \text{ см}^{-1}$ , т.е. выполнено условие  $kL \ll 1$ . Тогда тем более  $\alpha \ll 1$ , и главный вклад в затухание  $\Gamma$  дают слагаемые с  $n = \pm 1$ . Величина  $\Gamma$ , мнимая часть частоты плазменной волны, определяется как  $2\pi kQ/E_0^2$ , поскольку поверхностная плотность энергии электрического поля двумерного плазмона равна  $E_0^2/2\pi k$ . При  $kL \ll 1$  получается

$$\Gamma = \frac{e^2 k}{\omega m L^2} \left( \frac{U_0}{\hbar \omega} \right)^2 \left( \frac{4\sqrt{v_0^2 - u_-^2}}{\omega L} - \frac{u_-}{\sqrt{v_0^2 - u_-^2}} + \frac{4\sqrt{v_0^2 - u_+^2}}{\omega L} + \frac{u_+}{\sqrt{v_0^2 - u_+^2}} \right); \quad u_{\pm} = u \pm \omega L. \quad (7)$$

Выражение (7) имеет смысл при таких значениях  $u$ , когда все подкоренные выражения положительны. В противном случае соответствующие слагаемые в (7) должны быть опущены. Кроме того, подразумевается выполненным неравенство  $kLU_0 \ll m\omega^2 L^2$ , соответствующее условию  $\alpha \ll 1$ . При указанных выше значениях  $N_s$  и  $k\omega \sim 10^{12} \div 10^{13} \text{ сек}^{-1}$ , что обеспечивает выполнение этого неравенства. В отсутствие дрейфа затухание имеет минимум при  $\omega \sim v_0/L$  и возрастает как при малых  $\omega$ , так и при  $\omega \rightarrow v_0/L$ .

$$\Gamma = \frac{2e^2 k}{m\omega^2 L^3} \left( \frac{U_0}{\hbar \omega} \right)^2 \frac{4v_0^2 - 3\omega^2 L^2}{\sqrt{v_0^2 - \omega^2 L^2}}. \quad (8)$$

Усиление волны ( $\Gamma < 0$ ) имеет место в интервале значений  $u$ , определяемом неравенствами:

$$\sqrt{v_0^2 + (\omega L/8)^2} + \frac{7}{8} \omega L < u < v_0 + \omega L \quad (9)$$

(последние два слагаемых (7) при этом выпадают). Вблизи верхней границы интервала  $u_{max} = v_0 + \omega L$  коэффициент усиления растет пропорционально  $(u_{max} - u)^{-1/2}$ .

Таким образом, усиление может быть получено при скоростях дрейфа  $u \sim v_0$ , что составляет  $3 \cdot 10^6 \div 3 \cdot 10^7$  см/сек для типичных МДП структур на кремнии. Эти, довольно большие, значения дрейфовых скоростей представляются все же экспериментально достижимыми. В то же время усиление двумерных плазменных волн в однородной системе (например, в схеме двух пространственно разделенных слоев) требует скорости дрейфа порядка  $\omega/k$ . Эта величина может составлять  $10^8 \div 10^9$  см/сек, что гораздо больше  $v_0$ .

Институт физики полупроводников  
Академии наук СССР  
Сибирское отделение

Поступила в редакцию  
9 сентября 1980 г.

### Литература

- [1] В.А.Петров. ФТП, 12, 380, 1978.
- [2] М.В.Крашенинников, А.В. Чаплик. ФТП, 15, вып. 1, 1981.
- [3] Е.М.Лифшиц, Л.П.Питаевский. Физическая кинетика. М., изд. Наука, 1979, § 30.